# 實驗九 NMOS 與 PMOS 之直流特性

# 零件

VP2410L, VN2410L 各一枚; 精密電阻 1k 一枚;

精密電阻 51Ω 一枚; 冷卻劑;

電熱吹風機(請自備)。

# 目的

- 1. 瞭解 NMOS 與 PMOS 之直流操作特性,並比較他們的異同。
- 2. 測試操作特性的溫度效應。

# 相關背景知識

- 1. MOSFET 的操作原理及分類。
- 2. NMOS 和 PMOS 的直流電流電壓特性。

## VP2410L 和 VN2410L 的說明:

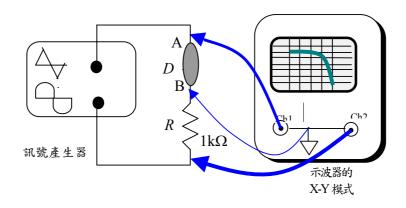
這個實驗所用到的 MOSFET 編號是 VP2410L 和 VN2410L,前者是 PMOS,而後者是 NMOS 電晶體,他們的接腳圖請查閱元件資料庫的網頁。我們使用的這兩種電晶體源極 (source) 已經和基板 (substrate) 連在一起,也有一些其他的電晶體源極 (source) 和基板 (substrate) 沒有連在一起,我們可以根據需要來選擇用哪一個電晶體。

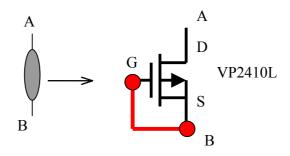
這次實驗所使用的 MOSFET 都是加強型的(enhancement),在  $V_{GS}$ =0 時,他們應該是在截止區(OFF),即源極(source)和汲極(drain)間不導通。

# 程序

#### 一、MOS 中之二極體

我們這裡要利用實驗五的方法(程序3的動態特性曲線測試)來測試PMOS和NMOS中D(汲)極和基板間二極體的特性。測量方法示意圖如下:





- 1. 我們先選一個 PMOS 來測試, 閘極和源極連在一起以避免閘極浮接效應 (floating gate effect), 然後測量汲極與基板間 pn 接面的 IV 特性, 即把上面測量方法圖中的 待測元件換成圖中的 PMOS 電路。記錄示波器上的圖形, 逆向偏壓時的崩潰電壓多大?
- 2. 對 NMOS 重複上面步驟。請注意 PMOS 和 NMOS 的偏壓方向有何不同?

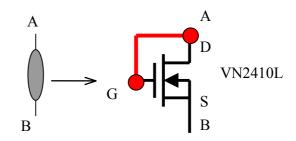
#### 二、臨界電壓

這裡介紹一個簡易測試 MOSFET 臨界電壓的方法。對加強型 NMOS 而言,所謂的臨界電壓是指  $V_{GS}$ 大到剛好將電晶體啟動(turn on)的值,通常記做  $V_{T}$ 或  $V_{th}$ 。在 on 狀態的 MOS,又依在靠近汲極的通道是否有載體存在,分為歐姆區(是)及飽和區(否)。假如將一個加強型 MOS 的 G 和 D 極短路,外加 DS 偏壓,則 MOS 只會在截止(cut off)或飽和兩個狀態,而不可能進入歐姆區(為什麼?)。

### 1. 動態測量 NMOS 的臨界電壓

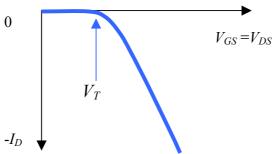
將 NMOS 接成如右圖電路, 代替上面程序一中 AB 間的 電路。

調整訊號產生器的 DC offset 使得 NMOS 的  $V_{DS}$ >0。



#### 應用電子學電驗講義(I)

調整好以後,你可以在示波器看到類似下面的曲線,開始導通的電壓就是臨界電壓。 將圖形記錄下來。



再來接著測試溫度的影響。先用熱風槍加熱 MOS,觀察圖形的變化,你是否可看出臨界電壓及 k(transconductance parameter)的變化?再用冷卻劑將 MOS 冷卻,記錄變化。

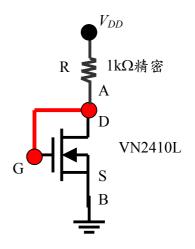
## 2. 動態測量 PMOS 的臨界電壓

將步驟 1 中的 NMOS 以 PMOS 取代,同樣將 G 和 D 短路,重複步驟 1。注意這裡  $V_{DS}$  必須調成小於 0。

### 3. 直流測量 NMOS 的 k 與 $V_T$

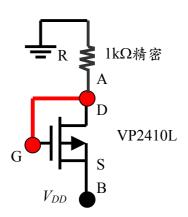
這裡要用 DVM(數位電表)仔細的測量電流及偏壓。電路如右圖, $V_{DD}$  由直流電源供應器提供,由 0V 慢慢增加,利用 DVM 測 R 的端電壓可得電流  $I_D$ , $V_{GS}=V_{DS}$  也可利用 DVM 量得,紀錄  $I_D$ 對  $V_{GS}$ 之關係。測到電流為 20mA 為止。

先畫出  $I_D$ 對  $V_{GS}$ 之關係,再以 $(I_D)^{1/2}$ 對  $V_{GS}$ 做圖,是否為一條直線?由其 X 軸的截距即可得到  $V_T$ ,由斜率可推知 k。



#### 4. 直流測量 PMOS 的 k 與 $V_T$

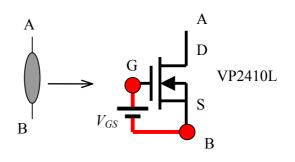
這裡對 PMOS 重複步驟 3 的實驗,注意電源的接法和 NMOS 不同。



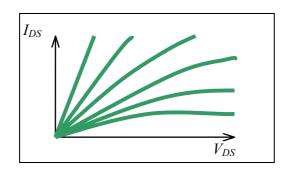
### 應用電子學電驗講義(I)

### 三、NMOS 的輸出特性曲線

1. 這裡是要量測在不同閘極偏壓( $V_{GS}$ )下  $I_{DS}$ 對  $V_{DS}$ 的關係。將程序 1 動態量測圖中 AB 間之待測元件用右圖電路代替。 $V_{GS}$  利用直流電源供應器提供(注意:電源供應器的接地要拿掉!!),由 0V 掃到 3V,每隔 0.2V (必要時你可以用其他的間隔)記錄  $I_{DS}$ 對  $V_{DS}$ 的圖形



(包括每一軸的單位),把他們畫在一起,可得到類似下面圖形。 注意! 調整訊號產生器的 DC offset 使得  $V_{DS}$  均為正的。



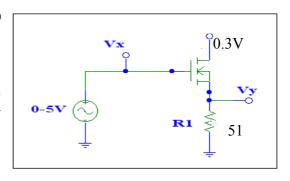
2. 選取一個有明顯  $I_{DS}$  輸出的  $V_{GS}$ ,在<u></u>示波器上觀察  $I_{DS}$  對  $V_{DS}$  曲線(例如上圖之曲線甲),利用液態氮或電熱吹風機改變 IC 的溫度,記錄  $I_{DS}$ - $V_{DS}$  曲線對溫度的變化。

### 四、PMOS 的操作曲線

選擇一個 PMOS, 重複程序四裡的步驟 1 及 2。但步驟 1 的  $V_{GS}$  、  $V_{DS}$  必須是負值。

## 五、線性區的特性

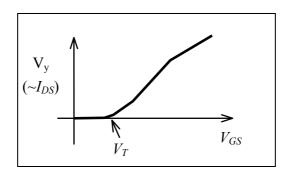
1.對於 NMOS 而言, $V_{GS}$ 必須大於  $V_{T}$ ,D極和 S極間才開始導通。當  $V_{DS}$  很小時,D極和 S極間像是一個電阻(電阻值由 $V_{GS}$  控制),在此操作區間, $I_{DS}$  和  $V_{DS}$  成正比,故稱為線性區或歐姆區。這個實驗是要在線性區內,固定一個小的  $V_{DS}$ 值,觀察  $I_{DS}$  對  $V_{GS}$  的關係。



### 測試電路圖如右:

訊號產生器的範圍設在 0-5V 間,用來提供  $V_{GS}$ ,接到示波器的 X 軸。在 S 極和接地間串聯一個  $51\Omega$ 的小電阻,用來將  $I_{DS}$  轉換為電壓訊號  $(V_v = I_{DS} \times 51\Omega)$  接到示波

器的 Y 軸輸入。你可以得到類似下面的圖:



由圖中可直接找出臨界電壓  $V_T$ 。

由這個圖你是否能換算成 DS 間電阻對  $V_{GS}$  的關係?注意  $51\Omega$ 造成的誤差。

- 2.用吹風機將 IC 加熱, $V_y$ 對  $V_{GS}$ 曲線如何變化?注意曲線與 X 軸的交點及交點附近的斜率。用冷卻劑把 IC 冷卻,結果如何?
- 3. 將電晶體換為 PMOS, 直流電源換為-0.3V,  $V_{GS}$ 必須小於 0, 重複上面步驟。

# 預習問題

- 1. 閱讀應電實驗室網頁元件資料庫中 VP2410L 和 VN2410L 的資料,我們用的是 TO-92 包裝的元件,請畫出他們的接腳。並查出他們的元件參數  $(k \oplus V_T)$  範圍。
- 2. 寫出 NMOS 和 PMOS 在線性區及飽和區的電流電壓特性方程式。
- 3. 為何將加強型 MOS 的 G和 D 極短路,在 DS 間加偏壓, MOS 一定在截止或飽和區操作?

# 問題與討論

- 1. 在程序一中,PMOS 和 NMOS 的 D 極和 substrate (和 S 短路) 間的 I-V 曲線有何不同?為什麼?
- 2. (a)把程序三、四中對不同  $V_{GS}$  所得之  $I_{DS}$ - $V_{DS}$  曲線畫在一起,標出線性區和飽和區(或恆流區)。
- (b)在飽和區內對一固定  $V_{DS}$ ,做  $\sqrt{I_{DSAT}}$  對  $V_{GS}$  圖  $(I_{DSAT}$  是在飽和區中  $I_{DS}$  的值)。在理想情況下,此曲線該是怎樣的圖形?你所得到的是不是這樣?X 軸的截距有何意義?
- 3. 請比較由各程序所得之臨界電壓有何不同?用哪一種方法測臨界電壓比較好?
- 4. 温度對  $I_{DS}$  及  $V_T$  有何影響?解釋你的結果。

2002/10/15 修訂 孫允武 中興物理